Магнитофоторефрактивный эффект в Bi₁₂TiO₂₀

© М.П. Петров, В.М. Петров, П.М. Караваев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 25 апреля 1997 г.)

С помощью регистрации сигнала небрэгтовской дифракции на осциллрующей голографической решетке впервые обнаружено влияние магнитного поля на голографическую запись в фоторефрактивном кристалле Bi₁₂TiO₂₀.

Запись голограмм в фоторефрактивных средах связана с переносом заряда фотовозбужденных носителей. Поэтому вполне естественным является интерес к изучению влияния магнитного поля на процесс записи голограмм в этих материалах. Однако окисные фоторефрактивные кристаллы, такие как LiNbO₃, Bi₁₂TiO₂₀ и др., являются высокоомными материалами, поэтому влияние магнитного поля на запись голограмм за счет эффекта Холла на термолизованных носителях в этих кристаллах мало, так как низка дрейфовая подвижность. Тем не менее известны работы, в которых были предприняты попытки наблюдать влияние магнитного поля на фоторефрактивный эффект и голографическую запись в LiNbO₃ [1-3]. Причем в [1,3] такое влияние было обнаружено, а в [2] — нет. Для объяснения наблюдаемых эффектов в [3] была предложена модель [3,4], учитывающая изменение фотовольтаических токов при записи голограмм ортогонально поляризованными пучками [5] за счет приложения магнитного поля.

В настоящей работе сообщается о наблюдении магнитофоторефрактивного эффекта в Bi₁₂TiO₂₀. При этом наибольшее внимание уделено проблеме достоверности получаемых экспериментальных данных. Использовалась методика голографической адаптивной интерферометрии, когда запись голограммы проводится двумя лучами, один из которых промодулирован по фазе с некоторой частотой $(\Omega/2\pi)$ (рис. 1). При этом голограмма записывается интерференционной картиной, колеблющейся с частотой $\Omega/2\pi$ относительно своего среднего положения. Идея эксперимента заключается в том, чтобы обнаружить с помощью дифракции света влияние магнитного поля на осцилляции голографической решетки, поскольку осцилляции носят резонансный характер и в области резонанса чувствительность голографической записи к внешним воздействиям возрастает. Подробности методики описаны в [6]. В настоящей работе регистрировался сигнал, соответствующий первому небрэгговскому порядку дифракции (трехволновое взаимодействие), и одновременно регистрировались амплитуды U_{Ω} на частоте Ω и $U_{2\Omega}$ на частоте 2Ω . В качестве анилизируемой экспериментальной величины выбрано отношение $R = U_{2\Omega}/U_{\Omega}$. Измерение именно этой величины позволяет свести к минимуму погрешности эксперимента, связанные с нестабильностью лазера и небольшой неконтролируемой разъюстировкой схемы

в течение длительного эксперимента вследствие изменения внешних условий, в том числе вследствие изменения магнитного поля. Кроме того, параметр *R* оказывается нечувствительным к возможным незначительным поворотам плоскости поляризации света, обусловленным магнитооптическим эффектом. Одновременно при этом обеспечивается высокая чувствительность схемы. Измерения проводились на монокристалле Bi₁₂TiO₂₀, использованном в [6]. Толщина кристалла 0.7 mm, срез (110). Электрическое поле прикладывалось в основном вдоль оси [110]. Внешнее электрическое поле прикладывалось с помощью несимметричной системы электродов, что обеспечивало существование как компоненты поля E_0 , параллельной оси [110], так и компоненты вдоль оси [110], достигающей 10-20% от поля Е₀. Вектор записываемой голографической решетки Kg направлен вдоль оси $[1\bar{1}0]$. Магнитное поле направлено вдоль оси [001], падающий свет поляризован также вдоль этой оси. Использовался постоянный магнит с поворачивающимся ярмом, остаточное поле в зазоре магнита 0.134 Т. Фазовая модуляция осуществлялась с помощью вибрирующего зеркала (рис. 1), амплитуда модуляции $\theta \approx 0.3$ rad. Интенсивность записывающего света 10⁻¹ W/cm², отношение интенсивностей падающих на кристалл лучей *R* и *S*: $I_S/I_R = 3.3$, контраст интерференционной картины $m \approx 0.85$, модуль $K_g = 2\pi 12.8 \,\mathrm{rad} \cdot \mathrm{mm}^{-1}$. На рис. 2 показана зависимость R(H) для двух противоположных направлений электрического поля при $\Omega/2\pi = 8$ Hz. Выбор именно этой частоты обусловлен тем, что, как показали предварительные измерения, в нашем образце максимумы U_{Ω} и $U_{2\Omega}$ находятся в области 7-10 Hz. Из данных рис. 2 видно, что эффект изменения R(H), во-первых, надежно регистрируется, во-вторых, имеет в основном осциллирующую компоненту по Н и, в-третьих, зависит от взаимной ориентации Н и Е. Зависимость на рис. З практически целиком связана с осцилляциями U_{Ω} , в то время как изменения $U_{2\Omega}$ незначительны. Рис. 4 показывает зависимость R от частоты модуляции. Кроме того, были проведены измерения R в зависимости от электрического поля при различных Н и обнаружено существенное влияние Н. Было установлено также, что величина эффекта зависит от предыстории образца, т. е. от предварительной засветки и длительного нахождения в магнитном поле. Совокупность всех приведенных данных позволяет утверждать, что нами надежно



Рис. 1. *а*) Схема установки. *1* — Не-Ne-лазер, *2* — светоделитель, *3* — вибрирующее зеркало, *4* — кристалл Bi₁₂TiO₂₀, *5* — поляризаторы, *6* — фотодетектор, *7* — спектроанализатор, *8* — направление силовых линий магнитного поля, *R*, *S* — лучи, падающие на кристалл. *b*) Геометрия электродов на кристалле. *9* — электроды.



Рис. 2. Зависимости R(H) при $\Omega/2\pi = 8$ Hz для значений поля +6 (1, 2) и -6 kV/cm (3, 4) при изменениях H от 0.134 до 1.5 T (1, 3) и от 1.5 до 0.134 T (2, 4).

обнаружено влияние магнитного поля на голографическую запись в фоторефрактивном кристалле $Bi_{12}TiO_{20}$. Таким образом, впервые обнаружен магнитофоторефрактивный эффект в этом кристалле.

Для интерпретации наблюдаемых эффектов необходимо рассчитать величину *R*. Несложно получить теоретическое выражение для U_{Ω} в приближении малых амплитуд фазовой модуляции и $m \ll 1$. В то же время $U_{2\Omega}$ определяется несколькими конкурирующими механизмами, и однозначный расчет $U_{2\Omega}$ более сложен. Однако, поскольку экспериментально $U_{2\Omega}$ слабо зависит от H, то, пользуясь методом расчета электрического



Рис. 3. Типичные зависимости $U_{\Omega}(H)$ (1) и $U_{2\Omega}(H)$ (2) для $E_0 = -6$ kV/cm при изменении H от 1.5 до 0.134 T.



Рис. 4. Зависимости $R(\Omega/2\pi)$ для H = 0.134 (1) и 1.5 T (2) при $E_0 = -6$ kV/cm.

поля решетки пространственного заряда при фазовой модуляции одного из записывающих лучей, описанным в [7], и используя данные [6], можно показать, что

$$R \approx C\theta (K_g \mu \tau E_0)^{-1}, \tag{1}$$

где C — коэффициент, зависящий от m. Здесь также принято допущение, что $K_g \mu \tau E_0 > 1$, и величина R рассчитана в точке Ω , удовлетворяющей условию $K_g \mu \tau E_0 \Omega \tau_M = 1$, где μ — дрейфовая подвижность, τ —

время жизни носителей, τ_M — максвелловское время релаксации.

Эмпирически влияние внешнего магнитного поля может быть учтено путем замены E_0 в (1) на $E_0 + \Delta E$, где ΔE — некоторое эффективное электрическое поле, зависящее от величины H и взаимной ориентации E и H. Величина ΔE может достигать порядка E_0 . Физическая природа столь большого эффекта в настоящее время не вполне ясна. Эффект не может быть объяснен ни за счет магнитооптических явлений, ни за

счет обыкновенного эффекта Холла на термолизованных носителях при учете лишь одного типа носителей. В кристаллах со структурой силленита постоянная Верде $(V_r \approx 0.1 - 0.2 \min \cdot \text{Oe}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} [8])$, холловская подвижность ($\mu \approx 2.5 \,\mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{V}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ [9]) малы. Известные фотогальванические эффекты [10-12] также пренебрежимо малы, так как они дают соответствующие поля много меньше 1 V. Теоретический анализ описанных экспериментов затруднен тем обстоятельством, что в действительности в голографической записи принимают участие как электроны, так и дырки; кроме того, голографическая запись происходит в нелинейном режиме [6], поскольку т блико к единице. В этом случае существует большое число процессов дифракции на осциллирующих решетках, вносящих вклад в один и тот же наблюдаемый дифракционный пик, и результирующий сигнал будет весьма чувствительным к фазовым соотношениям между различными решетками. Возможно, что влияние магнитного поля на эти фазовые соотношения и объясняет большую величину наблюдаемого эффекта. Влияние магнитного поля на голографическую запись за счет фазовых сдвигов решеток на свободных носителях рассматривалось в [13].

Обнаруженная зависимость наблюдаемого эффекта от предыстории образца может быть связана с участием мелких ловушек в процессе генерации или захвата фотовозбужденных носителей.

Список литературы

- [1] А.Р. Погосян, Б.Н. Попов, Е.М. Уюкин. ФТТ **24**, *9*, 2551 (1982).
- [2] И.Ф. Канаев, В.К. Малиновский, А.М. Пугачев. ФТТ 29, 3, 692 (1987).
- [3] C. Dam-Hansen, P.M. Johansen, P.M. Petersen, V.M. Fridkin. Phys. Rev. **B52**, 13 098 (1995).
- [4] C. Dam-Hansen, P.M. Johansen, P.M. Petersen, V.M. Fridkin. J. Opt. Soc. Am. B13, 2286 (1996).
- [5] С.Г. Одулов. Письма в ЖЭТФ 35, 10 (1982).
- [6] M.P. Petrov, V.M. Petrov, I.S. Zouboulis, L.P. Xu. Opt. Comm. 134, 569 (1997).
- [7] M.P. Petrov, I.A. Sokolov, S.I. Stepanov, G.S. Trofimov. J. Appl. Phys. 68, 2216 (1990).
- [8] Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ. Пер. с яп. Л. (1990). 256 с.
- [9] S.L. Sochava, K. Buze, E. Kratzig. Phys. Rev. B51, 4684 (1995).
- [10] М.П. Петров, А.И. Грачев. Письма в ЖЭТФ 30, 18 (1979).
- [11] A.I. Grachev, M.P. Petrov. Ferroelectrics 43, 181 (1982).
- [12] В.Г. Лазарев, В.М. Фридкин, А.Л. Шленский. Письма в ЖЭТФ 44, 275 (1986).
- [13] В.Л. Винецкий, Н.В. Кухтарев, С.Г. Одулов, М.С. Соскин. ЖТФ 47, 6, 1270 (1977).